

Sehr geehrte Mitglieder,

wir möchten alle interessierten Kollegen zu der Abschlusspräsentation des Projektes

Mikrobereichs- und Spurenanalyse durch Kombination von Elektronenstrahlmikroanalyse und der Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse in Rasterelektronenmikroskopen

einladen.

Dieses Projekt wurde im Rahmen des Förderprogramms ProFIT, Grundlagenmodul Optische Technologien, durch das Land Berlin gefördert. Diese Präsentation soll dazu beitragen, die Ergebnisse dieses Projektes der Grundlagenforschung allen interessierten Unternehmen und Forschungseinrichtungen zugänglich zu machen.

Die Untersuchungen im Rahmen des Projektes beschränkten sich nicht nur auf die Kombination der beiden röntgenspektroskopischen Analysemethoden, sondern erstreckten sich auch auf die für eine standardfreie Röntgenfluoreszenz-Analyse notwendige Bestimmung des Spektrums, das eine Mikrofokus-Röntgenquelle emittiert, und auf die Ausdehnung der Röntgenfluoreszenzanalyse am REM unter Einbeziehung von Röntgenlinien unterhalb 2 keV.

**Ort: BAM, Zweiggelände Fabeckstr.,
Unter den Eichen 44-46, 12203 Berlin,
Haus 89, Raum 120**

Termin: 6. Dezember 2007, 14 -17 Uhr

Wir bitten Sie, Ihre Teilnahme der Geschäftsstelle von OpTecBB mitzuteilen und ggf. diese Einladung auch im Mitarbeiterkreis bekanntzumachen (Anlage Einladung).

Abschlusspräsentation der Ergebnisse zum Verbundprojekt „Methodenkopplung ESMA/RFA am REM“ von Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) und dem Institut für angewandte Photonik (IAP)

Termin: 6. Dezember 2007
Zeit: 14 – 17 Uhr
Ort: BAM, Zweiggelände Fabeckstr.,
Unter den Eichen 44-46, 12203 Berlin,
Haus 89, Raum 120

(Der Veranstaltungsraum wird bereits um 13:30 Uhr für einen kleinen Imbiss der Gäste geöffnet)

Programm:

- 14:00 Begrüßung durch OptecBB, IAP und BAM
- 14:10 Vorstellung der Ziele und der einzelnen Arbeitspakete des Projektes (Dr. Procop)
- 14:25 Das Prinzip der Methodenkopplung ESMA/ μ -RFA (Eggert)
- 14:45 Anwendungsbeispiele für die Methodenkopplung ESMA/ μ -RFA am REM (Kemf, Dr. Hodoroaba)
- 15:15 Ein spezieller Vakuum-Messplatz zur Charakterisierung von Röntgen-Kapillarroptiken (Dr. Wedell, Dr. Bjeoumikhov)
- 15:30 Pause
- 16:00 Berechnung der Spektren von Röntgenröhren mit Hilfe experimentell bestimmter Röntgenausbeuten (Dr. Procop)
- 16:15 Bestimmung der aktuellen Transmission der Röntgenoptik am iMOXS durch Vergleich berechneter Streuspektren ohne Optik und gemessene Streuspektren mit Optik (Dr. Hodoroaba)
- 16:45 Erschließung des Energiebereiches unterhalb 5 keV für die μ -RFA am REM (Dr. Procop)
- 17:00 Abschließende Diskussion und Bewertung der Ergebnisse
- 17:30 Laborbesichtigungen in BAM VI.43 „Oberflächenanalytik“ (REM/EDX/WDX, AES, XPS, SIMS) – Voranmeldung erforderlich